

Vlastnosti nanostruktur mohou být silně ovlivněny změnami jejich rozhraní. Díky své hloubkové citlivosti a bezkontaktnímu měření jsou magnetooptická spektroskopie a spektroskopická elipsometrie ideální ke studiu takových jevů. Dvě metody nevratné modifikace magnetických vlastností, a to zejména magnetické anizotropie, jsou zkoumány v této práci. Změřené spektrální závislosti magnetooptického Kerrova jevu jsou porovnány s teoretickými výpočty za účelem určení profilů vzorků pro různé úrovně a různé metody modifikace. Dále jsou provedena elipsometrická měření na zařízení, jehož optické vlastnosti je možno měnit přikládáním elektrického napětí.